Docket No.: R2184.0254/P254 (PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:

Masaki Ninomiya, et al.

Application No.: Not Yet Assigned

Filed: Concurrently Herewith

Art Unit: N/A

For: OPTICAL DISK DEVICE AND TILT

CORRECTION METHOD

Examiner: Not Yet Assigned

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS

MS Patent Application Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. 119 based on the following prior foreign application filed in the following foreign country on the date indicated:

CountryApplication No.DateJapan2002-253738August 30, 2002

Application No.: Not Yet Assigned Docket No.: R2184.0254/P254

In support of this claim, a certified copy of the said original foreign application is filed herewith.

Dated: August 26, 2003

Respectfully submitted,

Mark J. Thronson

Registration No.: 33,082

DICKSTEIN SHAPIRO MORIN &

OSHINSKY LLP

2101 L Street NW

Washington, DC 20037-1526

(202) 785-9700

Attorney for Applicant

Japan Patent Office

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: August 30, 2002

Application Number:

Japanese Patent Application

No.2002-253738

[ST.10/C]:

[JP2002-253738]

Applicant(s):

RICOH COMPANY, LTD.

August 15, 2003

Commissioner,

Yasuo Imai (Seal) Japan Patent Office

Certificate No.2003-3066544

日本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月30日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-253738

[ST. 10/C]:

[JP2002-253738]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社リコー

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 8月15日





【書類名】

特許願

【整理番号】

0205245

【提出日】

平成14年 8月30日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

G11B 7/095

【発明の名称】

光ディスク装置およびチルト補正方法

【請求項の数】

7

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】

二宮 正樹

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】

大野 武英

【特許出願人】

【識別番号】

000006747

【氏名又は名称】

株式会社 リコー

【代理人】

【識別番号】

100112128

【弁理士】

【氏名又は名称】

村山 光威

【電話番号】

03-5993-7171

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

063511

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9813682

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ディスク装置およびチルト補正方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 回転する光ディスクに光を照射して情報の記録/再生を行う 光ピックアップと、光ディスクと前記光ピックアップの相対的なチルトを検出す るチルト検出手段と、光ディスク半径方向における前記光ピックアップの位置を 検出する光ピックアップ位置検出手段と、前記チルト検出手段から出力されるチ ルト検出データを記憶するチルト記憶手段と、このチルト記憶手段に記憶された チルト検出データに基づいてチルトを補正するチルト補正手段とを有し、予め設 定した光ディスクの半径方向の複数のチルト検出位置に前記光ピックアップを移 動させ、前記チルト検出手段が検出した各チルト検出位置におけるチルトを前記 チルト記憶手段に記憶する光ディスク装置において、

前記複数のチルト検出位置の間隔を、光ディスクの内周から外周に行くにしたがって短くしたこと特徴とする光ディスク装置。

【請求項2】 隣り合うチルト検出位置間の略中央位置を境界として、光ディスクの領域を複数に分割し、前記光ピックアップの位置がどの領域にあるかを判断する領域判定手段と、前記光ピックアップの位置が属する領域に対応するチルト検出位置のチルト検出データに基づいて前記チルト補正手段を制御するチルト制御手段とを有することを特徴とする請求項1記載の光ディスク装置。

【請求項3】 最も内周側のチルト検出位置よりも内周の領域では最も内周側のチルト検出データを出力し、最も外周側のチルト検出位置よりも外周の領域では最も外周側のチルト検出データを出力し、チルト検出位置の間では両側のチルト検出データから補間したチルト計算結果を出力するチルト算出手段と、このチルト算出手段の出力に基づいて前記チルト補正手段を制御するチルト制御手段とを有することを特徴とする請求項1記載の光ディスク装置。

【請求項4】 光ディスクの管理情報を読み取って、予め設定したチルト検出位置が記録/未記録境界のあたる場合には、実際のチルト検出位置を予め設定したチルト検出位置に対して半径方向にシフトさせることを特徴とする請求項1、2または3記載の光ディスク装置。

【請求項5】 回転する光ディスクに光を照射して情報の記録/再生を行う 光ピックアップと、光ディスクと前記光ピックアップの相対的なチルトを検出す るチルト検出手段と、光ディスク半径方向における前記光ピックアップの位置を 検出する光ピックアップ位置検出手段と、前記チルト検出手段から出力されるチ ルト検出データを記憶するチルト記憶手段と、このチルト記憶手段に記憶された チルト検出データに基づいてチルトを補正するチルト補正手段とを有し、予め設 定した光ディスクの半径方向の複数のチルト検出位置に前記光ピックアップを移 動させ、前記チルト検出手段が検出した各チルト検出位置におけるチルトを前記 チルト記憶手段に記憶する光ディスク装置のチルト補正方法において、

前記複数のチルト検出位置の間隔を、光ディスクの内周から外周に行くにしたがって短くすること特徴とするチルト補正方法。

【請求項6】 隣り合うチルト検出位置間の略中央位置を境界として、光ディスクの領域を複数に分割し、前記光ピックアップの位置が属する領域に対応するチルト検出位置のチルト検出データに基づいてチルトを補正することを特徴とする請求項5記載のチルト補正方法。

【請求項7】 最も内周側のチルト検出位置より内周では最も内周側のチルト検出データに基づいてチルトを補正し、最も外周側のチルト検出位置より外周では最も外周側のチルト検出データに基づいてチルトを補正し、チルト検出位置の間では両側のチルト検出データから補間したチルト計算結果に基づいてチルトを補正することを特徴とする請求項5記載のチルト補正方法。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1\]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、光ディスクの面に対して常に垂直方向にレーザが照射されるように レーザの角度を補正する機能を有する光ディスク装置およびチルト補正方法に関 する。

[0002]

【従来の技術】

光ディスクのトラック上に記録再生のためのレーザ光を集光して微小な光スポ

ットを形成するための対物レンズは、光ディスクに対してその光軸が傾くと、光 スポットに収差が生じ、記録再生に支障をきたすおそれがある。そのため、光デ ィスクの記録面に対する対物レンズの傾きは極力小さくしなければならない。

[0003]

光ディスクとしては、CD-ROM、CD-R、CD-RWといったものが一般に普及しているが、特に近年、CD系の光ディスクよりもトラック密度が高く 高容量化を実現したDVD系の光ディスクが登場し、再生用のDVDは既に一般 に普及し、記録用のDVDも実用化されている。

[0004]

このような光ディスクの高密度化に伴い、光学系の収差を増加させる要因である光ディスクと光学系との傾き(以下、チルトと称する)を補正する機構を備えた装置が増加している。

[0005]

チルトを補正する機構としては、従来より、LEDを用いた発光素子と、この発光素子の出射光が光ディスクで反射した反射光を受光する2分割受光素子によるチルトセンサと、このチルトセンサの出力に基づいて対物レンズあるいは光ピックアップを傾動させる機構とからなるチルト補正装置が提案されている。このようなチルトセンサは初期的にチルトのない光ディスクに対して2分割受光素子の出力に差が無いように設置姿勢が調整されており、発光素子の出射光が光ディスクによって反射されてチルトセンサに入射することにより、チルトセンサ上に反射光スポットが形成される。この反射光スポットの差信号を取ることによりチルトが検出される。

[0006]

また、チルトを検出する方法としては、他にもRF信号、TE信号が最大となるようなチルト補正値を取得してチルトを検出する方法がある。さらに、チルトを補正する方法としては、予め光ディスク上の幾つかの点でのチルト補正値を取得しておき、このデータを基にチルト制御を行う方法と、光ディスクの傾きを常に取得してチルトサーボを行う方法とがある。

[0007]

従来、この種の技術としては、特開2000-339727号公報に記載された技術があり、ディスクの半径方向の各位置でのチルトを予め測定して記憶し、記録再生時にその記憶したチルトに基づいてチルトを補正する光ディスク装置が提案されている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、予め光ディスク上の幾つかの点でRF信号、TE信号が最大となるようなチルト補正値を取得しておき、このデータを基にチルト制御を行う方法では、光ディスクの内周ではチルト絶対値および変化量が少なく、外周では大きいため、その間の補正値は複雑な演算などの処理、多くの補正値が必要となる。

[0009]

本発明は、このような問題点を解決し、少ない検出点で精度の高いチルト補正 値を得ることを実現した光ディスク装置およびチルト補正方法を提供することを 目的とする。

$[0\ 0\ 1\ 0]$

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するため、請求項1に係る発明は、回転する光ディスクに光を 照射して情報の記録/再生を行う光ピックアップと、光ディスクと前記光ピック アップの相対的なチルトを検出するチルト検出手段と、光ディスク半径方向にお ける前記光ピックアップの位置を検出する光ピックアップ位置検出手段と、前記 チルト検出手段から出力されるチルト検出データを記憶するチルト記憶手段と、 このチルト記憶手段に記憶されたチルト検出データに基づいてチルトを補正する チルト補正手段とを有し、予め設定した光ディスクの半径方向の複数のチルト検 出位置に前記光ピックアップを移動させ、前記チルト検出手段が検出した各チルト検出位置におけるチルトを前記チルト記憶手段に記憶する光ディスク装置において、前記複数のチルト検出位置の間隔を、光ディスクの内周から外周に行くに したがって短くしたこと特徴とする。このように構成したことにより、チルト変 化の少ない内周部ではチルト検出位置を少なくし、チルト変化の大きい外周部で はチルト検出位置を増やすことが可能になり、チルト検出位置の総数を増やすこ

5/

となく、より正確なチルト補正が行うことができる。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

請求項2に係る発明は、請求項1に係る発明において、隣り合うチルト検出位置間の略中央位置を境界として、光ディスクの領域を複数に分割し、前記光ピックアップの位置がどの領域にあるかを判断する領域判定手段と、前記光ピックアップの位置が属する領域に対応するチルト検出位置のチルト検出データに基づいて前記チルト補正手段を制御するチルト制御手段とを有することを特徴とする。このように構成したことにより、チルト検出位置の数を減らすことが可能になり、しかも、隣り合う検出位置間における補正値を求めるための演算が必要なくなり、制御の簡略化が図れるようになる。

[0012]

請求項3に係る発明は、請求項1に係る発明において、最も内周側のチルト検 出位置よりも内周の領域では最も内周側のチルト検出データを出力し、最も外周 側のチルト検出位置よりも外周の領域では最も外周側のチルト検出データを出力 し、チルト検出位置の間では両側のチルト検出データから補間したチルト計算結 果を出力するチルト算出手段と、このチルト算出手段の出力に基づいて前記チル ト補正手段を制御するチルト制御手段とを有することを特徴とする。このように 構成したことにより、チルトの算出ができない最も内周側のチルト検出位置より も内周の領域、および最も外周側のチルト検出位置よりも外周の領域におけるチ ルトの補正値を設定することができる。

[0013]

請求項4に係る発明は、請求項1,2または3に係る発明において、光ディスクの管理情報を読み取って、予め設定したチルト検出位置が記録/未記録境界のあたる場合には、実際のチルト検出位置を予め設定したチルト検出位置に対して半径方向にシフトさせることを特徴とする。このように構成したことにより、記録部分における反射率が未記録部分の反射率に比較して小さくなるために、未記録部から記録部への横断、記録部から未記録部への横断の際にチルトセンサに入射する信号が大きく変動し、チルトの検出に誤差が発生することによって、正確なチルト補正が行えなくなるといった問題を回避することができる。

[0014]

請求項5に係る発明は、回転する光ディスクに光を照射して情報の記録/再生を行う光ピックアップと、光ディスクと前記光ピックアップの相対的なチルトを検出するチルト検出手段と、光ディスク半径方向における前記光ピックアップの位置を検出する光ピックアップ位置検出手段と、前記チルト検出手段から出力されるチルト検出データを記憶するチルト記憶手段と、このチルト記憶手段に記憶されたチルト検出データに基づいてチルトを補正するチルト補正手段とを有し、予め設定した光ディスクの半径方向の複数のチルト検出位置に前記光ピックアップを移動させ、前記チルト検出手段が検出した各チルト検出位置におけるチルトを前記チルト記憶手段に記憶する光ディスク装置のチルト補正方法において、前記複数のチルト検出位置の間隔を、光ディスクの内周から外周に行くにしたがって短くすること特徴とする。このように構成したことにより、チルト変化の少ない内周部ではチルト検出位置を少なくし、チルト変化の大きい外周部ではチルト検出位置を少なくし、チルト変化の大きい外周部ではチルト検出位置を増やすことが可能になり、チルト検出位置の総数を増やすことなく、より正確なチルト補正が行うことができる。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

請求項6に係る発明は、請求項5に係る発明において、隣り合うチルト検出位置間の略中央位置を境界として、光ディスクの領域を複数に分割し、前記光ピックアップの位置が属する領域に対応するチルト検出位置のチルト検出データに基づいてチルトを補正することを特徴とする。このように構成したことにより、チルト検出位置の数を減らすことが可能になり、しかも、隣り合う検出位置間における補正値を求めるための演算が必要なくなり、制御の簡略化が図れるようになる。

[0016]

請求項7に係る発明は、請求項5に係る発明において、最も内周側のチルト検 出位置より内周では最も内周側のチルト検出データに基づいてチルトを補正し、 最も外周側のチルト検出位置より外周では最も外周側のチルト検出データに基づ いてチルトを補正し、チルト検出位置の間では両側のチルト検出データから補間 したチルト計算結果に基づいてチルトを補正することを特徴とする。このように 構成したことにより、チルトの算出ができない最も内周側のチルト検出位置より も内周の領域、および最も外周側のチルト検出位置よりも外周の領域におけるチ ルトの補正値を設定することができる。

[0017]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。

[0018]

図1は本発明の第1実施形態の光ディスク装置における概略構成を示すブロック図であり、1は光ディスク、2はターンテーブル、3はスピンドルモータを示し、ターンテーブル2はスピンドルモータ3に固定され、ターンテーブル2に載置された光ディスク1は、スピンドルモータ3によって回転駆動される。4は対物レンズアクチュエータ、5はチルト補正機構、6はチルトセンサ、7は、対物レンズアクチュエータ4、チルト補正機構5、チルトセンサ6が備えられた光ピックアップを示す。対物レンズアクチュエータ4はチルト補正機構5を介して光ピックアップ7に取り付けられている。8は光ピックアップ7を半径方向に移動させるステッピングモータからなるシークモータ、9は、スピンドルモータ3、チルト補正機構5、シークモータ8を駆動制御する駆動回路、10は検出アンプ、11はCPU、12はメモリを示す。

$[0\ 0\ 1\ 9]$

光ピックアップ7はシークモータ8に駆動される駆動機構に搭載されており、 内周基準位置からのシークモータ8の駆動パルスをカウントすることによって光 ピックアップ7の半径方向位置を特定することができる。

[0020]

チルト補正機構 5 は、対物レンズアクチュエータ 4 を機械的に回動させてレーザ光を半径方向に傾けるものであり、対物レンズアクチュエータ 4 の回動量を制御することによって光ピックアップ 5 のレーザ光が光ディスク 1 の面に対して常に垂直方向に照射されるように調整することができる。対物レンズアクチュエータ 4 の回動量はチルトセンサ 6 の検出信号に基づいて C P U 1 1 によって求められ、 C P U 1 1 からの信号に基づいて駆動回路 9 によってチルト補正機構 5 が駆

動制御される。

[0021]

チルトセンサ6には、発光素子と2分割の受光素子とが備えられており、発光素子から検出対象すなわち光ディスク1に光が照射され、その反射光が受光素子によって受光される。このとき、光ディスク1に傾きが無い場合には、受光素子上の反射光スポットがチルトセンサ6の2分割された受光部の分割線上に当たる。しかし、光ディスク1に傾きがある場合には、この分割線上からずれる。そのため、2分割受光素子のそれぞれの受光量を比較することにより、光ディスク1の傾き量、すなわちチルトに対応した信号を得ることができる。具体的には、2分割受光素子の受光信号は検出アンプ10によって増幅され2つの信号の差の演算結果がチルト信号としてCPU11に送られる。

[0022]

ここで、前述したように、チルト補正には、予め光ディスク1上の幾つかの点でチルト補正値を取得してメモリ12に記憶させておき、このデータを基にチルト制御を行う方法と、チルトセンサ6を用いて、光ディスク1の傾きを常に取得してチルトサーボを行う方法とがある。本実施形態においては、前者の方法が用いられている。

[0023]

図2は光ディスクの反りを示すグラフである。一般的に光ディスクは外周ほど 反りがあり、内周部に比べ外周部はチルト量が大きくなっている。この場合のチルト制御において、例えば図3のように、光ディスク1に対して光ピックアップ 7を等間隔に内周側から外周側に移動させ、予め光ディスクのチルト補正値を、 検出点alからa6において測定し、その補正値t1からt6とすると、補正値を各々メモリ12に記憶させておくことによって光ディスク形状の学習を行う。 隣り合う 検出点の間も補正値は、その2点例えば検出点alと検出点a2の間では補正値t1と 補正値t2によって1次近似などにより求める。そして、記録/再生中の光ピックアップ7の位置を監視し、例えば光ピックアップ7が所定距離を移動する毎にその時の光ピックアップ7の位置に応じて補正値をメモリ12からCPU11が読み出してチルトの制御を行う。しかし、図3に示す方法では、外周部では実際の

チルト量の変化が大きいために、実際のチルト量と補正値の誤差が大きくなる。 そのため、検出点と検出点の間の補正値を正確に求めようとすると、演算が複雑 化する。検出点を多く取れば、簡単に1次近似などで求めることもできるが、マ ウント時間が長くなりユーザーの利便性がなくなる。

[0024]

図4は本発明のチルト補正方法の第1実施形態を説明するための説明図である。光ディスク1が光ディスク装置にマウントされた場合、光ディスク1の情報の記録、再生を行う前に光ピックアップ7を光ディスク1の検出点b1に移動させ、チルトセンサ6により検出点b1の位置におけるチルトを測定し、メモリ12に補正値t1を記憶する。次に検出点b2に移動させて、同様に補正値t2を取得する。このようなチルトの測定を繰り返すことによって、各々の検出点での補正値を取得し、検出点と検出点の間の補正値は記憶された補正値t1~t5において隣り合う補正値を用いて1次近似して光ディスク1の形状を学習する。この時、光ディスクの内周から外周にいくにしたがって、隣り合う検出点の間隔が短くなるように各検出点が設定されている。

[0025]

次に、補間する方法は、例えば検出点b1と検出点b2の間であれば、検出点b1の位置をX1、検出点b2の位置をX2、X1でのチルト補正値をT1、X2でのチルト補正値をT2とし、現在の位置Xにおける補正値をTとすると、(数 1)のように求め、検出点b1と検出点b2の間はこの式に基づいてチルト制御を行うようにする。

【数1】

$$T = T1 + \frac{T2 - T1}{X2 - X1}(X - X1)$$

[0027]

ここで、最も内周の検出点においては両側に検出点が無いので2点を用いた補間ができない。同様に、最も外周の検出点においても両側に検出点が無いので2点を用いた補間ができない。すなわち、チルトセンサ6は、対物レンズが位置する

光ディスク1の半径方向の直線上に配置されているため、最も内周の検出点に対してさらに内周側に若干の記録領域が存在し、最も外周の検出点に対してさらに外周側に若干の記録領域が存在する。光ピックアップ7の対物レンズがこれら領域に位置する場合には、その位置に対応するチルトが算出できない。そこで、最も内周の検出点より内周部では最も内周の検出点での補正値を用いてチルト制御を行い、最も外周の検出点より外周部では最も外周の検出点での補正値を用いてチルト制御を行う。

[0028]

ところで、書き換え型光ディスクのように記録・未記録部分がある場合、記録部分における反射率が未記録部分の反射率に比較して小さくなるために、未記録部から記録部への横断、記録部から未記録部への横断の際にチルトセンサ6に入射する信号が大きく変動する。このためチルトの検出に誤差が発生することになり、正確なチルト補正が行えなくなるといった問題が発生するおそれがある。このような問題を回避するために、光ディスクのTOC情報を基に、データが記録されている領域のアドレスを取得して記録・未記録領域を算出し、記録領域と未記録領域との境界部分が、予め設定されているチルトの検出点の近傍となる場合、具体的にはチルトの検出点を含む所定範囲内に入っている場合には、チルトの検出点を一定量ずらすように、光ピックアップ7の駆動制御を行う。

[0029]

このように構成した第1実施形態によれば、チルト変化の少ない内周部では検 出点を少なくし、チルト変化の大きい外周部では検出点が増えることになり、少 ない検出点で、演算を複雑にすることなく、より正確なチルト補正が行うことが できる。

[0030]

図5は本発明のチルト補正方法の第2実施形態を説明するための説明図である。第1実施形態のようにチルトを検出する半径方向位置の間隔を、光ディスク1の内周から外周にいくにしたがって短くし、かつ、検出点の間隔に対応して複数の領域に分け、各領域に対応するチルト検出結果に基づいてチルトを補正を行う。第2実施形態においては、第1実施形態の検出点b1,b2,……,b5における隣

り合う検出点間の領域をz1, ……, z4とした場合、各領域の中点を検出点c1, c2, c3, c4とし、検出点c1, c2, c3, c4におけるチルトを予め測定して補正値をメモリ12に記憶しておく。

[0031]

そして、例えば、領域z1のチルト補正を行う際に、検出点c1で得た補正値を使用してチルト制御を行う。領域z2では検出点c2で得た補正値、領域z3では検出点c3で得た補正値、領域z4では検出点c4で得た補正値のようにチルト制御を行うことで、演算をすることなく、チルト補正が行える。

[0032]

ここで、チルト補正を行う場合には、ピックアップ 7 がどの領域に存在するかを認識しておく必要がある。第 2 実施形態においては、検出点c1, c2, c3, c4、領域z1, z2, z3, z4はともにアドレス情報を用いて決定されており、そして、記録再生中において光ディスク 1 から得られるアドレス情報と比較することにより、ピックアップ 7 がどの領域に存在するかを認識することができる。

[0033]

このように第2実施形態によれば、検出点を中心としてある一定の領域を持ち、この領域も検出点と同様に外周部では小さくなる。そして、領域内では同じ検出点の補正値を使用するため、検出点と検出点の間の補正値の1次近似などの演算が必要なくなる。

$[0\ 0\ 3\ 4]$

なお、上述した実施形態においては、チルトセンサ6によってチルト検出を行うものであるが、それに限らず、チルトセンサ6を用いずにトラックエラー信号やRF信号を用いてチルト検出を行うものにも適用可能である。この場合、記録領域における最内周と最外周の位置のチルトを検出が可能になるため、光ディスク1の半径方向すべての位置に対応するチルトを演算によって得ることが可能になる。

[0035]

【発明の効果】

以上、説明したように構成された本発明によれば、チルト変化の少ない内周部

では検出点を少なくし、チルト変化の大きい外周部では検出点が増えることになり、少ない検出点で、演算を複雑にすることなく、より正確なチルト補正が行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の光ディスク装置の実施形態における概略構成を示すブロック図

【図2】

光ディスクの反りを示すグラフ

【図3】

チルト補正方法の参考例を説明するための説明図

図4】

本発明のチルト補正方法の第1実施形態を説明するための説明図

【図5】

本発明のチルト補正方法の第2実施形態を説明するための説明図

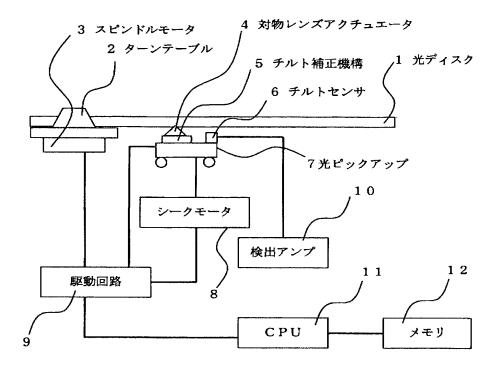
【符号の説明】

- 1 光ディスク
- 2 ターンテーブル
- 3 スピンドルモータ
- 4 対物レンズアクチュエータ
- 5 チルト補正機構
- 6 チルトセンサ
- 7 光ピックアップ
- 8 シークモータ
- 9 駆動回路
- 10 検出アンプ
- 11 CPU
- 1 メモリ

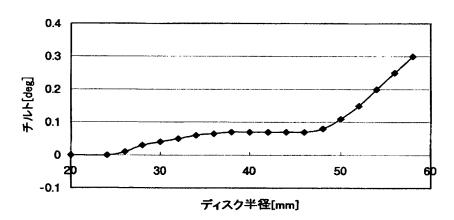
【書類名】

図面

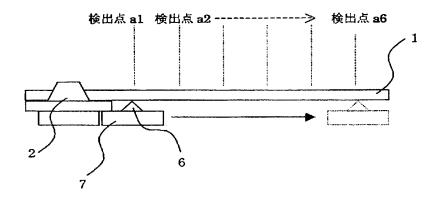
【図1】



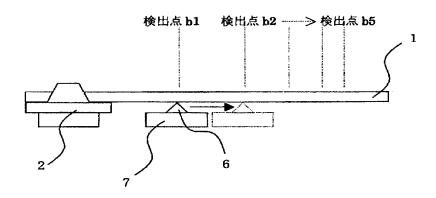
【図2】



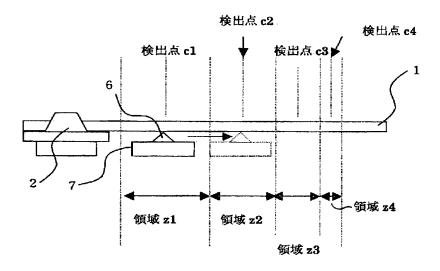
【図3】



【図4】



【図5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ディスクの半径方向の各位置でのチルトを予め測定して記憶し、 記録再生時にその記憶したチルトに基づいてチルトを補正する光ディスク装置に おいて、チルト補正をより正確に行うことを実現する。

【解決手段】 記録/再生に先立ってチルトを検出する複数のチルト検出位置を、光ディスク1の半径方向でかつチルト検出位置の間隔が光ディスク1の内間側から外周側にいくにしたがって狭くなるように予め設定し、記録/再生に先立ってチルトを検出する際に、各チルト検出位置でチルトを検出し、このチルト検出位置に対応するチルトの補正値をメモリ12に記憶する。

【選択図】 図1

特願2002-253738

出願人履歴情報

識別番号

[000006747]

1. 変更年月日 1990年 8月24日 [変更理由] 新規登録

> 住 所 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

氏 名 株式会社リコー

2. 変更年月日 2002年 5月17日

[変更理由] 住所変更 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 住 所

氏 名 株式会社リコー